

(12) 특허협력조약에 의하여 공개된 국제출원

(19) 세계지식재산권기구
국제사무국

(43) 국제공개일

2025년 5월 22일 (22.05.2025)



(10) 국제공개번호

WO 2025/105876 A1

(51) 국제특허분류:
G01R 31/28 (2006.01)

(21) 국제출원번호: PCT/KR2024/018155

(22) 국제출원일: 2024년 11월 18일 (18.11.2024)

(25) 출원언어: 한국어

(26) 공개언어: 한국어

(30) 우선권정보:
10-2023-0158726 2023년 11월 16일 (16.11.2023) KR

(71) 출원인: 주식회사 테크윙 (TECHWING, INC.) [KR/
KR]; 18487 경기도 화성시 동탄면 동탄산단6길 37 (KR).

(72) 발명자: 나윤성 (NA, Yun Sung); 31068 충청남도 천안시
동남구 향교1길 114-7 (KR).

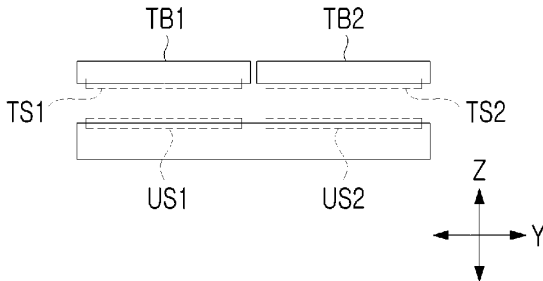
(74) 대리인: 특허법인 빛과소금 (LIGHT AND SALT
PATENT AND LAW FIRM); 08506 서울특별시 금천구
가산디지털2로 98, 1-312호 (KR).

(81) 지정국 (별도의 표시가 없는 한, 가능한 모든 종류의
국내 권리의 보호를 위하여): AE, AG, AL, AM, AO, AT,
AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH,
CL, CN, CO, CR, CU, CV, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ,
EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR,
HU, ID, IL, IN, IQ, IR, IS, IT, JM, JO, JP, KE, KG, KH,
KN, KP, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD,
MG, MK, MN, MU, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO,
NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW,
SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN,
TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

(84) 지정국 (별도의 표시가 없는 한, 가능한 모든 종류의
역내 권리의 보호를 위하여): ARIPO (BW, CV, GH, GM,
KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SC, SD, SL, ST, SZ, TZ,
UG, ZM, ZW), 유라시아 (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ,
TM), 유럽 (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE,
ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC,
ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM,
TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW,
KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

(54) Title: HANDLER FOR TESTING ELECTRONIC COMPONENTS AND PICKER DEVICE THEREOF

(54) 발명의 명칭: 전자부품 테스트용 핸들러 및 그 픽커장치



(57) Abstract: The present invention relates to a handler for testing electronic components. The handler for testing electronic components according to the present invention comprises: a test table on which electronic components to be tested are loaded; and a relocation mechanism for relocating the electronic components in a temporary zone of the test table to a designated position zone. The test table has a first unit region and a second unit region on which the electronic components are loaded. The first unit region corresponds to a first test region of a tester, the second unit region corresponds to a second test region of the tester, and the distance between the first unit region and the second unit region is greater than the distance between the electronic components loaded on the first unit region or the second unit region. When the present invention is applied, electrical connections between the electronic components and the test can be made accurately even when thermal expansion occurs.

(57) 요약서: 본 발명은 전자부품 테스트용 핸들러에 관한 것이다. 본 발명에 따른 전자부품 테스트용 핸들러는 테스트되어야 할 전자부품들이 적재되는 테스트테이블과 테스트테이블의 임시구역에 있는 전자부품을 정위치구역으로 재배치시키기 위한 재배치기구를 포함하고, 테스트테이블은 전자부품들이 적재되는 제1 단위영역과 제2 단위영역을 가지며, 제1 단위영역은 테스터의 제1 테스트영역에 대응되고, 제2 단위영역은 테스터의 제2 테스트영역에 대응되며, 제1 단위영역과 제2 단위영역 간의 간격은 제1 단위영역 또는 제2 단위영역에 적재된 전자부품들 간의 간격보다 넓다. 본 발명이 적용되면 열팽창이 발생한 경우에도 전자부품과 테스트 간에 전기적인 연결이 정확히 이루어질 수 있다.

[다음 쪽 계속]

WO 2025/105876 A1

공개:

— 국제조사보고서와 함께 (조약 제21조(3))